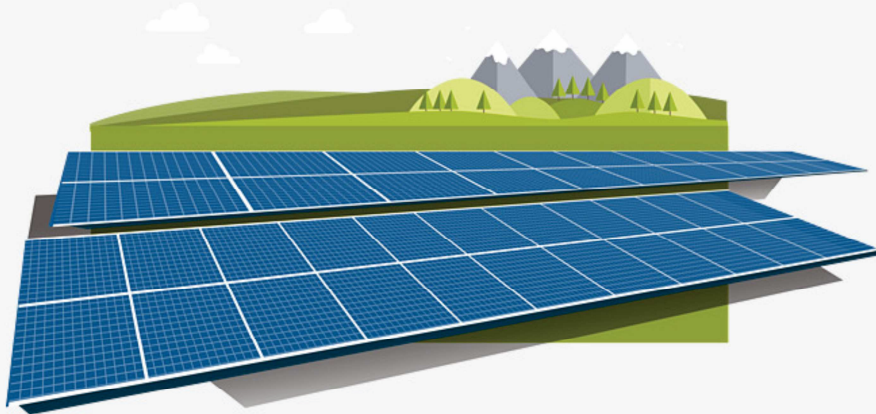


# Eletrônica de Potência

## Aula 04 – Transistores de potência

### Parte 1 – MOSFETs e COOLMOS



Prof. Heverton Augusto Pereira  
heverton.pereira@ufv.br

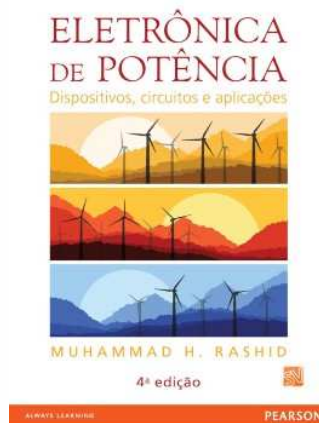


# Introdução

		Tópicos
01	-	Introdução
02	-	Diodos de potência e circuitos RLC chaveados
03	-	Retificadores com diodos
04	-	Transistores de potência
05		Conversores CC-CC
06		Tiristores
07		Retificadores controlados
08	-	Conversores CC-CA
09	-	Controladores de tensão CA
10	-	Inversores de pulso ressonante

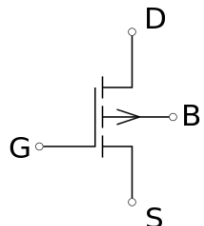
## Capítulo 4 do Livro

M. H. Rashid: Eletrônica de Potência: Dispositivos, circuitos e aplicações. 4ª. Edição, Pearson, 2014



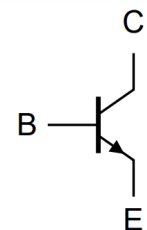
# Introdução

Transistores de potência podem ser classificados em cinco categorias:



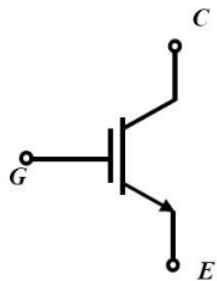
- MOSFETs — transistores de efeito de campo de óxido metálico semiconductor.

- COOLMOS.



- BJTs — transistores bipolares de junção.

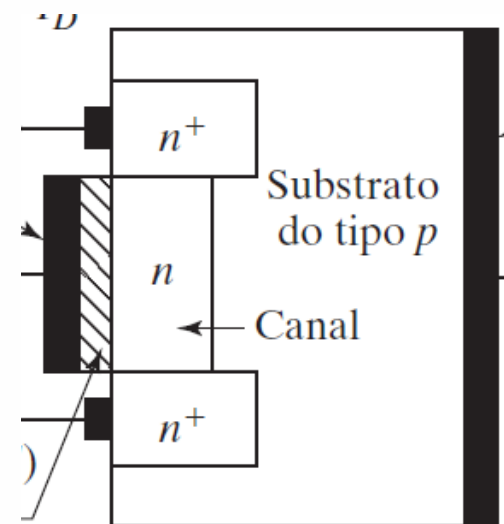
- IGBTs — transistores bipolares de porta isolada.



- SITs — transistores de indução estática.

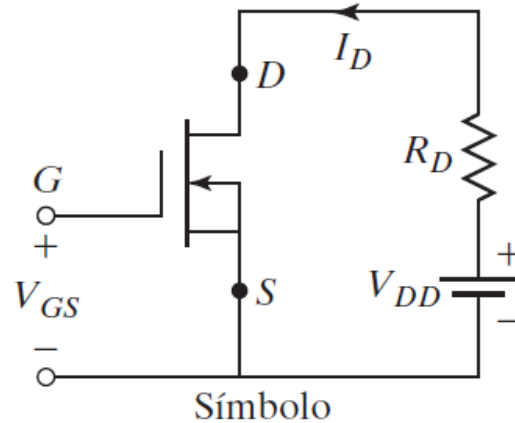
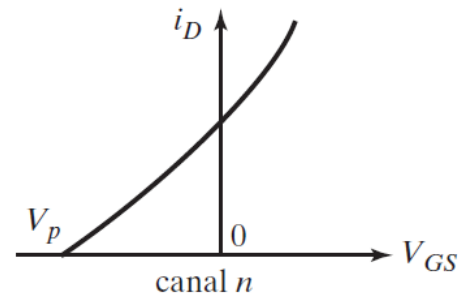
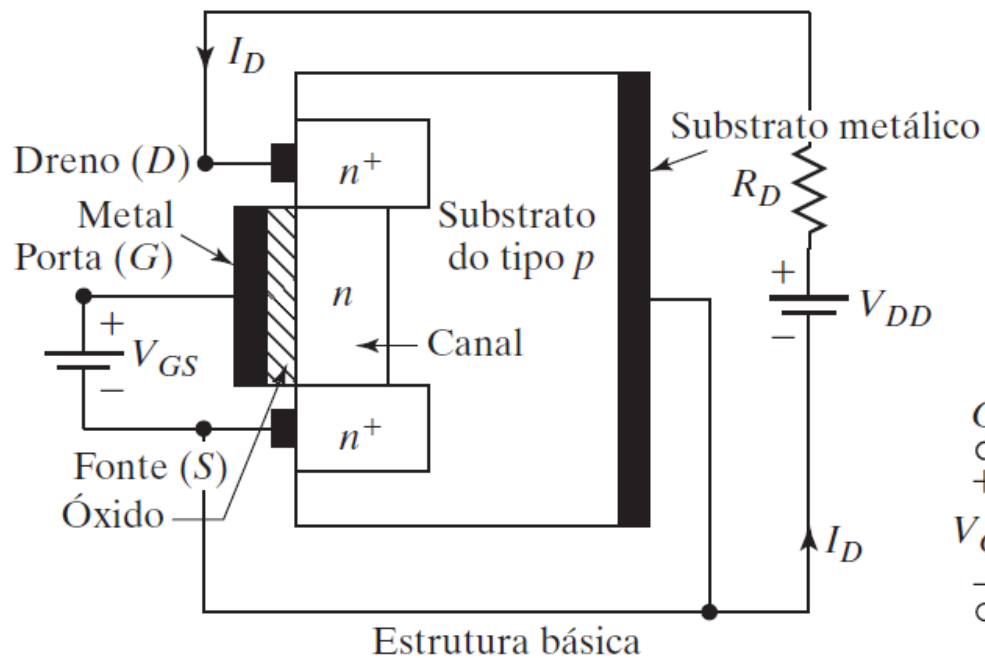
# MOSFETs de potência

- Um MOSFET de potência é um dispositivo controlado por tensão e que requer apenas uma pequena corrente de entrada.
- Os dois tipos de MOSFET são: (1) depleção e (2) intensificação.
- Um MOSFET tipo depleção de canal  $n$  é formado sobre um substrato de silício do tipo  $p$  com duas seções de silício fortemente dopadas  $n^+$ , para conexões de baixa resistência.
- Um MOSFET tipo intensificação de canal  $n$  não possui canal físico.



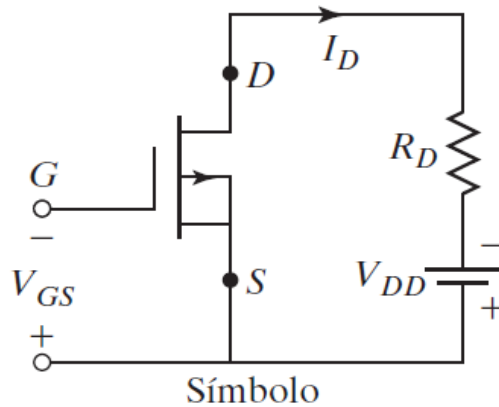
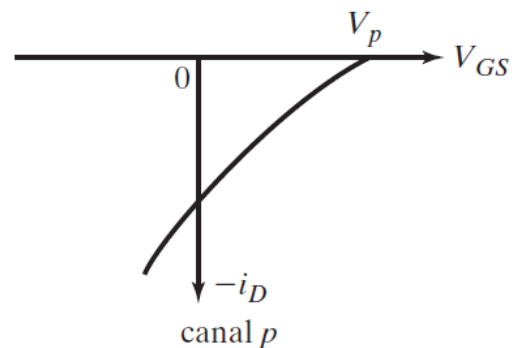
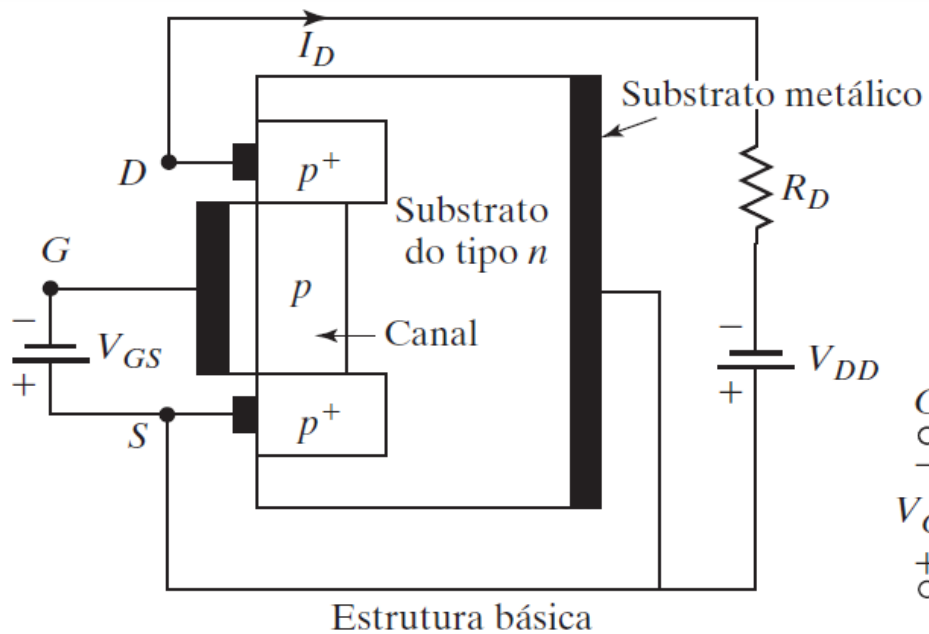
# MOSFETs de potência

- MOSFET tipo depleção de canal n:



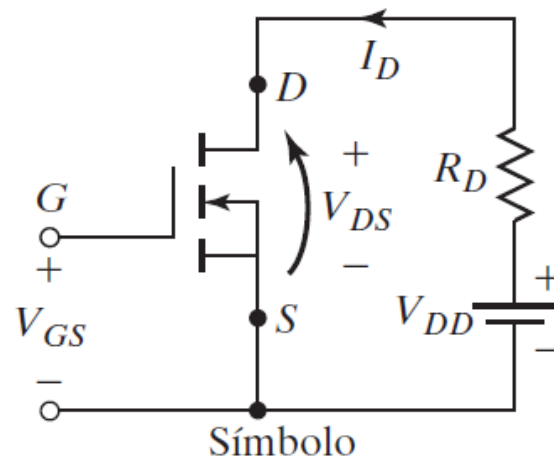
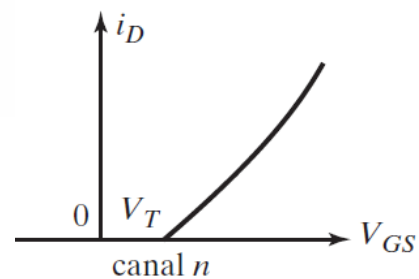
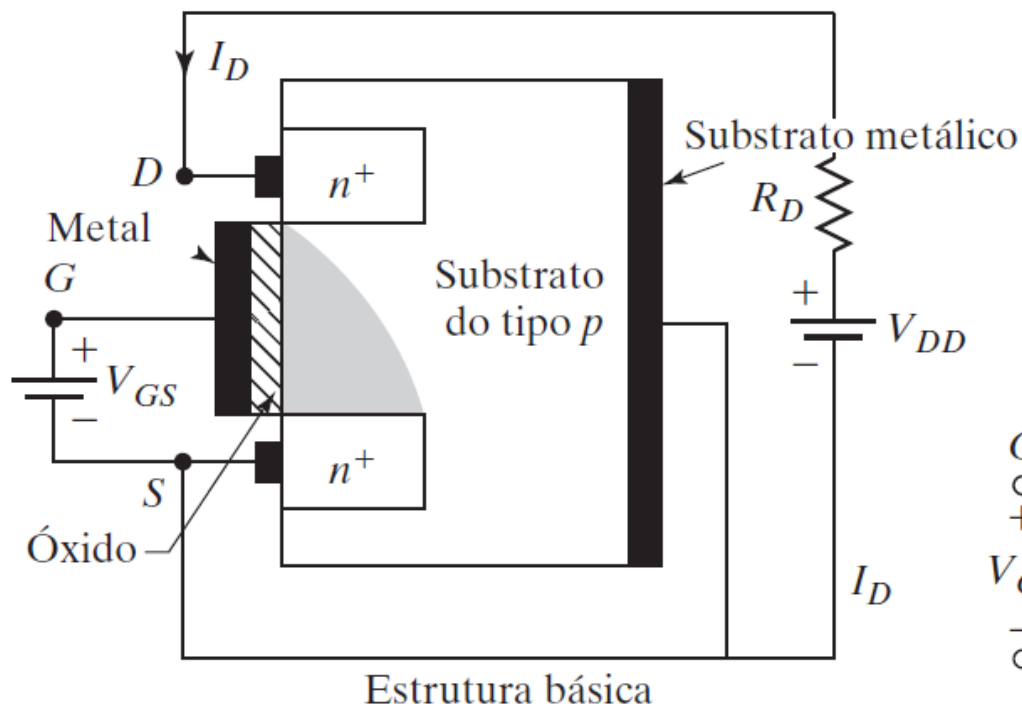
# MOSFETs de potência

- MOSFET tipo depleção de canal  $p$ :



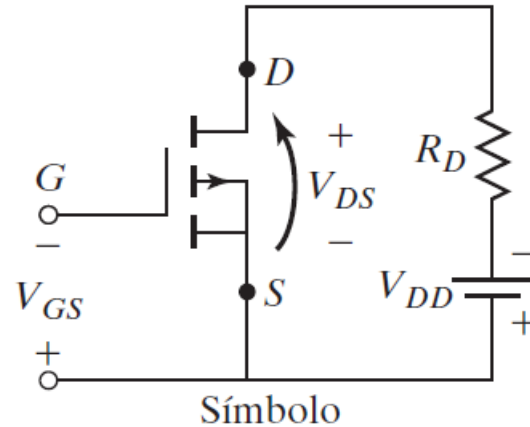
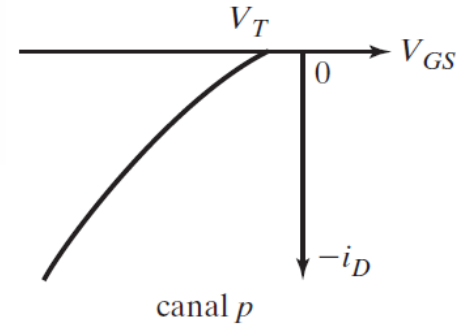
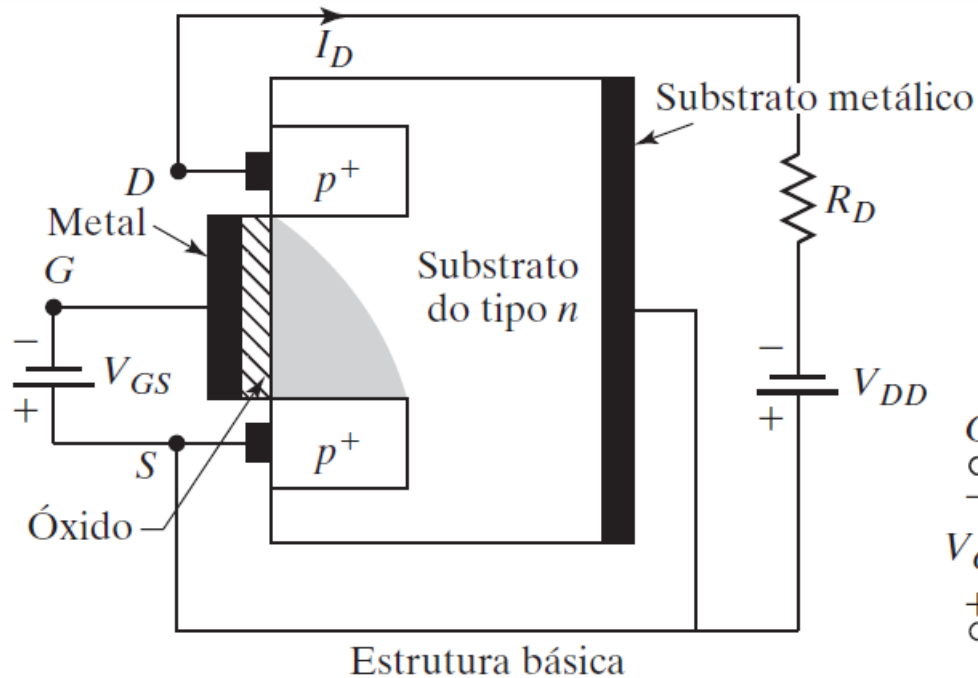
# MOSFETs de potência

- MOSFET tipo intensificação de canal n:



# MOSFETs de potência

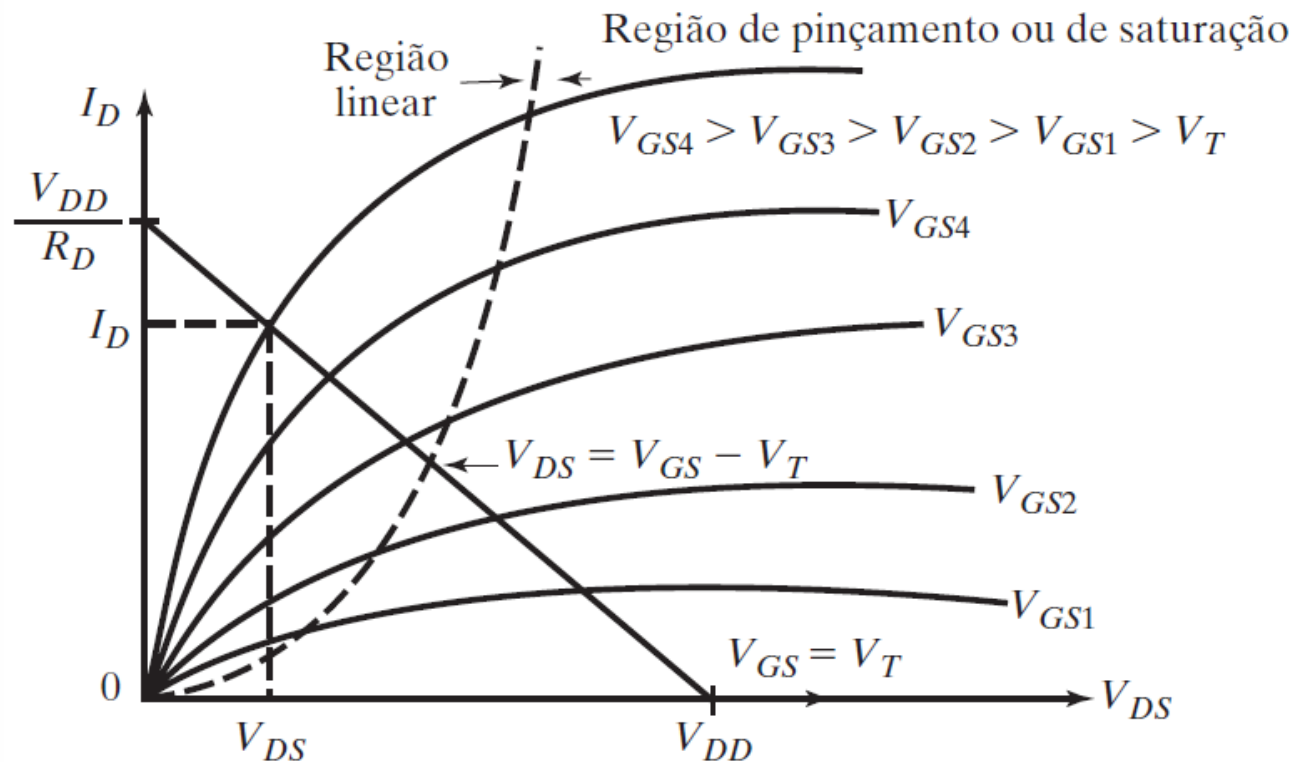
- MOSFET tipo intensificação de canal p:





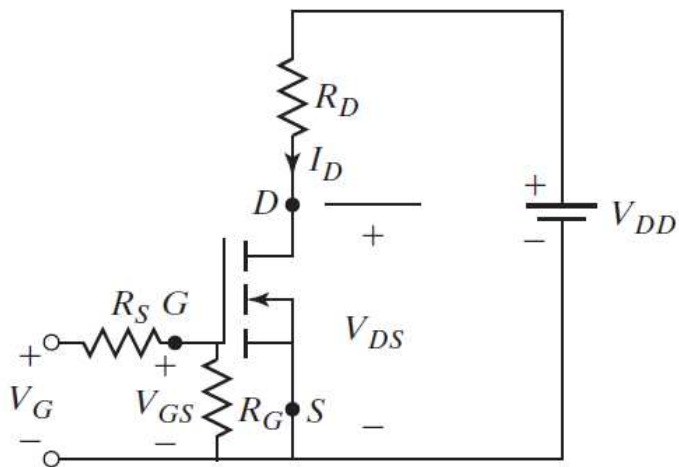
# Características em regime permanente

- Características de saída do MOSFET tipo intensificação:

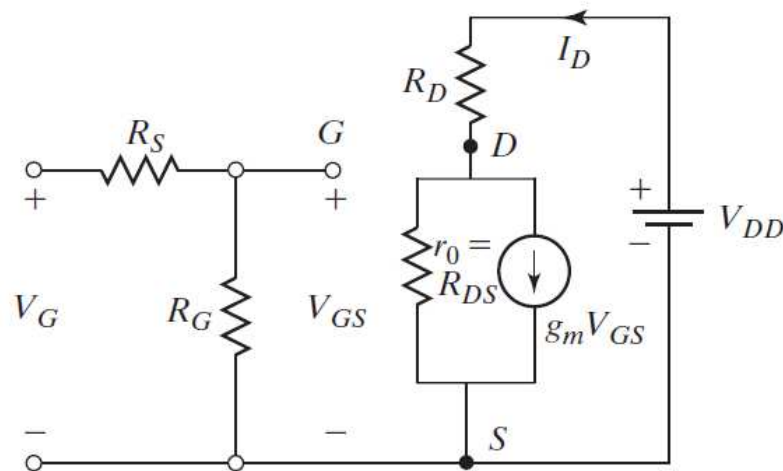


# Características de chaveamento

- Modelo de chaveamento em regime permanente dos MOSFETs:



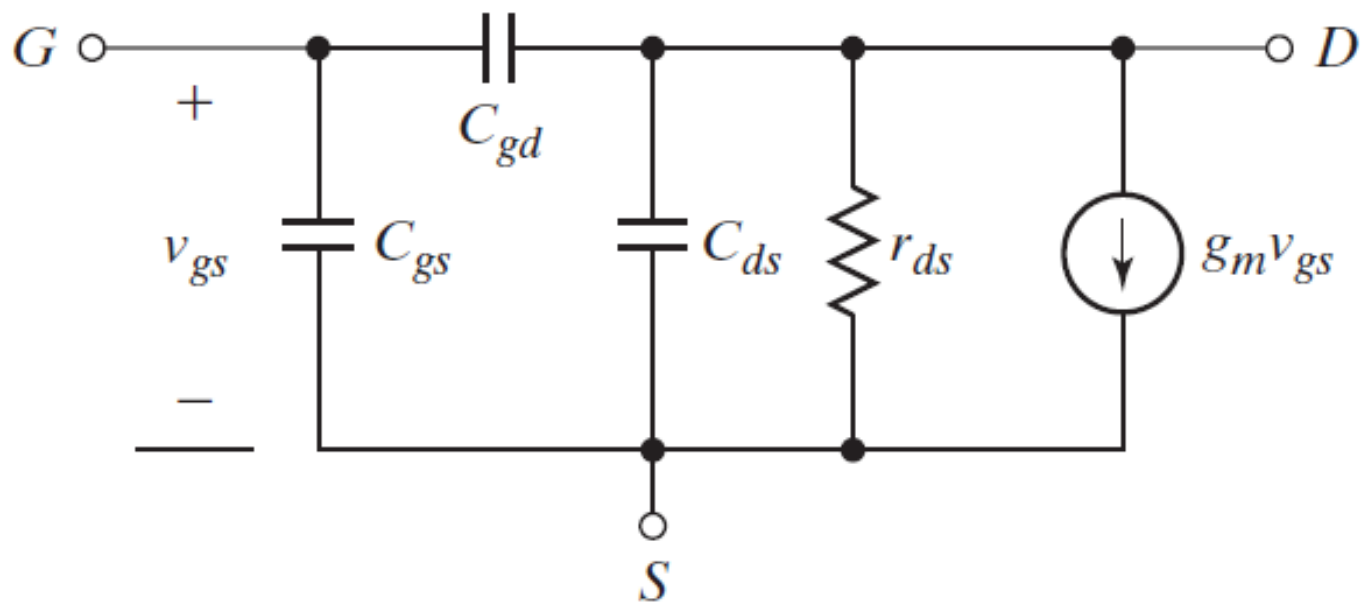
(a) Diagrama do circuito



(b) Circuito equivalente

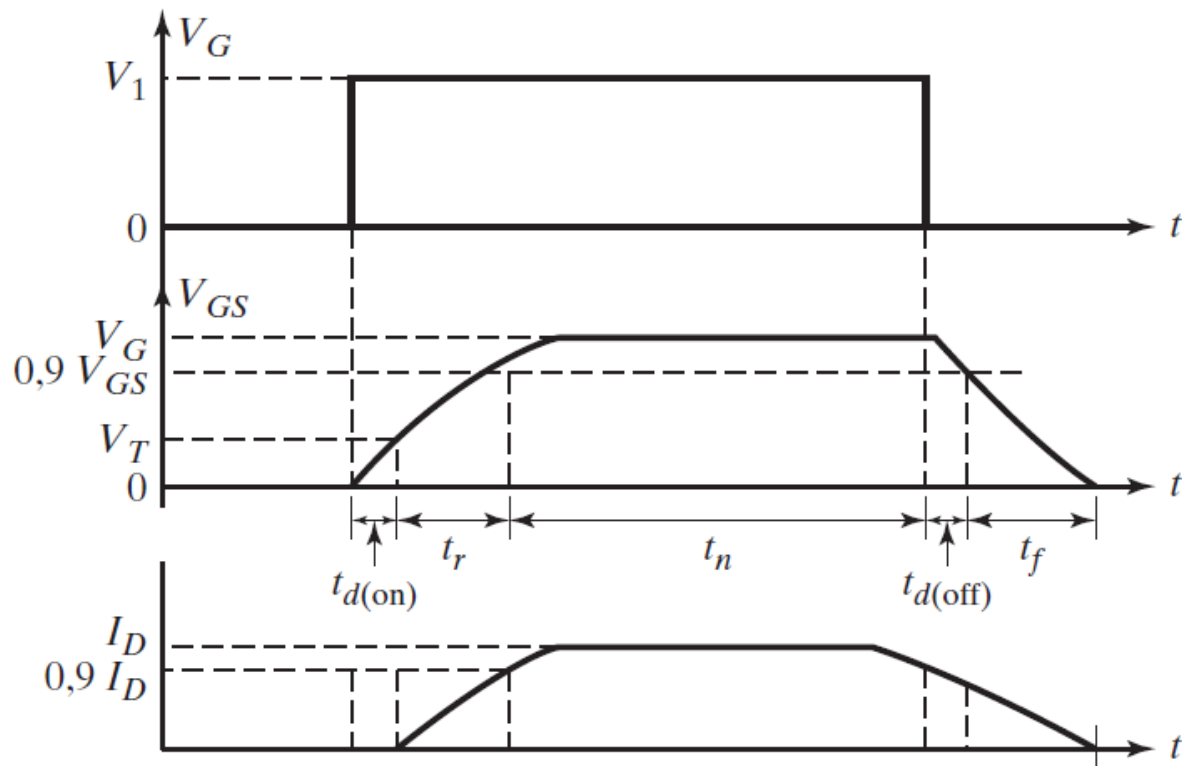
# Características de chaveamento

- Modelo de chaveamento dos MOSFETs:



# Características de chaveamento

- Formas de onda e tempos de chaveamento:



# MOSFETs de carbeto de silício

- A tecnologia SiC passou por avanços significativos que agora permitem a fabricação de MOSFETs capazes de superar o IGBT Si, em especial em alta potência e altas temperaturas.
- A nova geração de MOSFETs SiC reduz a espessura da camada de arraste (drift) por cerca de um fator de 10, enquanto possibilita que o fator de dopagem aumente simultaneamente na mesma ordem de grandeza.
- O efeito global resulta em uma redução da resistência de arraste a um centésimo da resistência do MOSFET equivalente em silício.

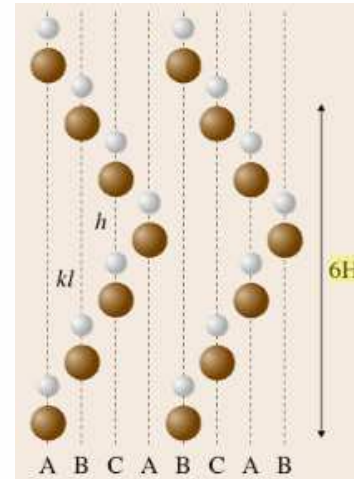
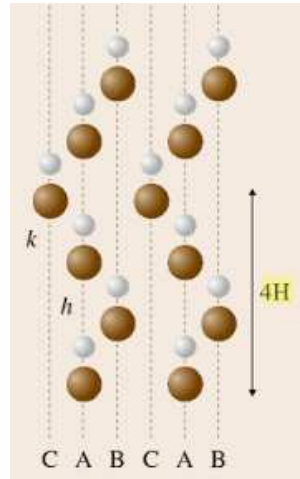
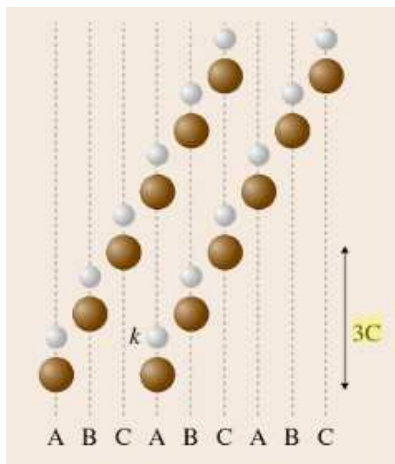
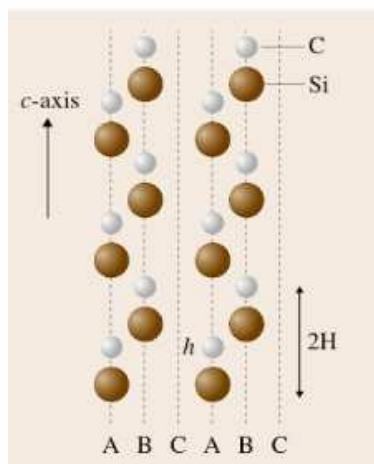
# Transistores de carbeto de silício

- Propriedades do silício e de materiais semicondutores WBG:





Parâmetro	Si	GaAs	4H-SiC	6H-SiC	3C-SiC	2H-GaN	Diamante
Energia de banda proibida, $E_g$ (eV)	1,1	1,42	3,3	3,0	2,3	3,4	5,5
Campo elétrico crítico, $E_c$ (MV/cm)	0,25	0,6	2,2	3	1,8	3	10
Velocidade de arraste dos elétrons, $v_{sat}$ (cm/s)	$1 \times 10^7$	$1,2 \times 10^7$	$2 \times 10^7$	$2 \times 10^7$	$2,5 \times 10^7$	$2,2 \times 10^7$	$2,7 \times 10^7$
Condutividade térmica, $\lambda$ (W/cm-K)	1,5	0,5	4,9	4,9	4,9	1,3	22

# Transistores de carbeto de silício

Parâmetro	Si	GaAs	4H-SiC	6H-SiC	3C-SiC	2H-GaN	Diamante
Energia de banda proibida, $E_g$ (eV)	1,1	1,42	3,3	3,0	2,3	3,4	5,5
Campo elétrico crítico, $E_c$ (MV/cm)	0,25	0,6	2,2	3	1,8	3	10
Velocidade de arraste dos elétrons, $v_{sat}$ (cm/s)	$1 \times 10^7$	$1,2 \times 10^7$	$2 \times 10^7$	$2 \times 10^7$	$2,5 \times 10^7$	$2,2 \times 10^7$	$2,7 \times 10^7$
Condutividade térmica, $\lambda$ (W/cm-K)	1,5	0,5	4,9	4,9	4,9	1,3	22







# Comparação de Fabricantes






Fabricante	Tecnologia	Preço	$V_{ds}$	$I_d$
Infineon 	Si	2,43 US\$	800 V	11 A
IXYS 	Si	15,02 US\$	800 V	44 A
Microsemi 	Si	20,99 US\$	800 V	47 A
STMicroelectronics 	Si	12,59 US\$	800 V	46 A



# SiC x Si

Fabricante	Tecnologia	Preço	$V_{ds}$	$I_d$
SMPS MOSFET (IRFB5620) 	SiC	R\$ 11,48	200 V	25 A
Infineon 	Si	1,43 US\$	200 V	24 A
STMicroelectronics 	Si	3,24 US\$	200 V	30 A
ROHM Semicondutores 	Si	1,57 US\$	200 V	30 A

# SiC x Si

Fabricante		Tecnologia	Preço	$V_{ds}$	$I_d$
ROHM Semicondutores		SiC	42,06 US\$	650 V	93 A
STMicroelectronics		Si	19,94 US\$	650 V	84 A
Microsemi		Si	21,33 US\$	650 V	95 A
IXYS		Si	15,65 US\$	650 V	80 A
Infineon		Si	14,04 US\$	650 V	83,2 A

# SiC x Si

- SiC ROHM 650 V 93 A

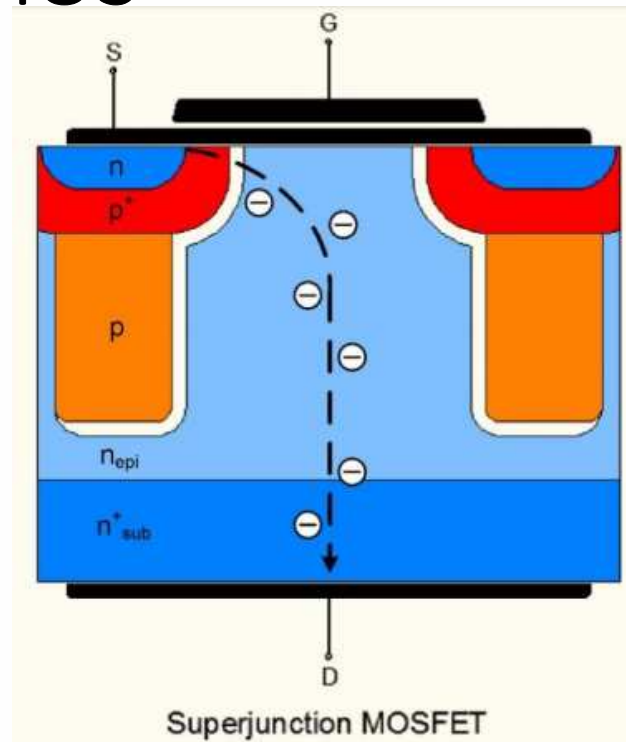
Parâmetros		Valor	Unidade
$V_{GS}$		22	V
$V_{DS}$		650	V
$I_D$	25°C	93	A
	100°C	65	A
Potência Dissipada		339	W
$R_{DS}$		22	mΩ
Temperatura de Junção		175	°C
Perdas na Comutação	Ligar	252	μJ
	Desligar	201	μJ

- Si Microsemi 650 V 95 A

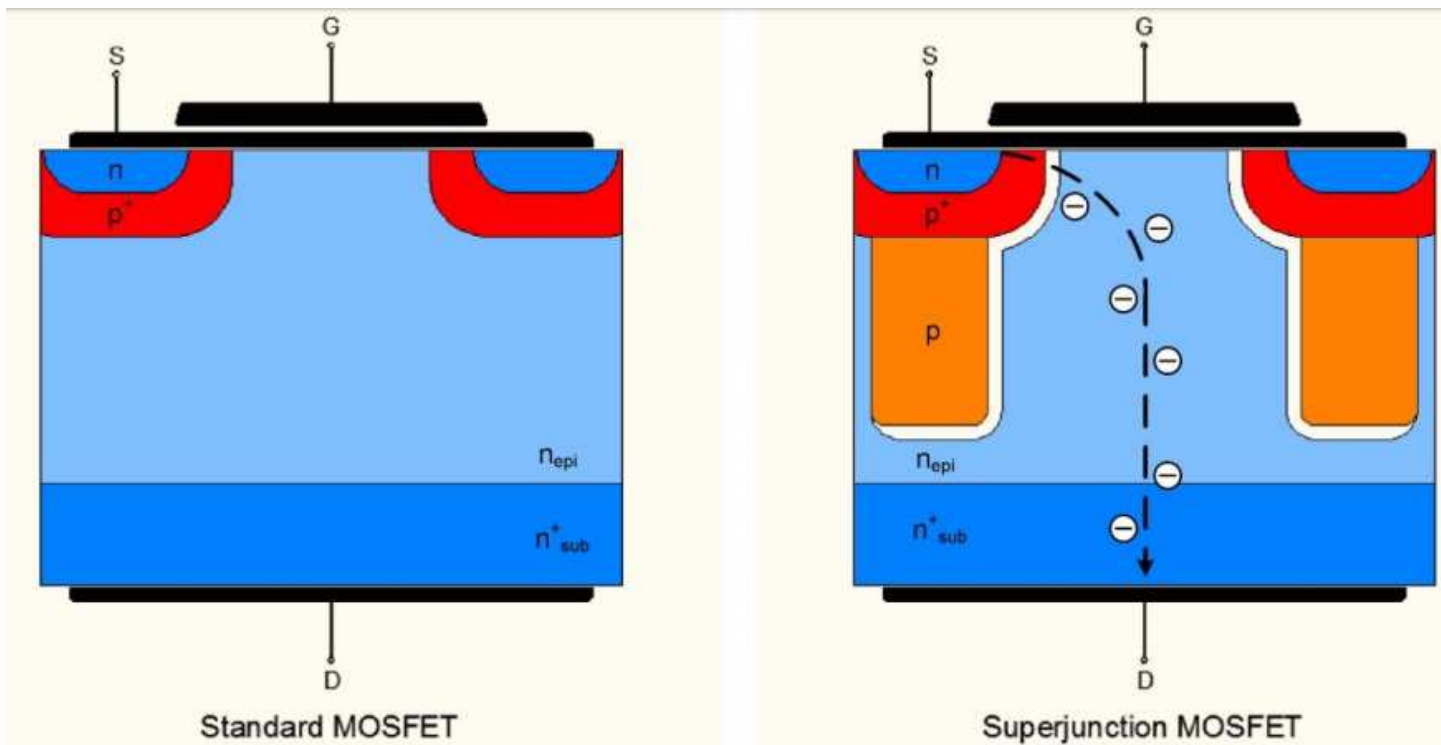
Parâmetros		Valor	Unidade
$V_{GS}$		20	V
$V_{DS}$		650	V
$I_D$	25°C	95	A
	100°C	61	A
Potência Dissipada		833	W
$R_{DS}$		35	mΩ
Temperatura de Junção		150	°C
Perdas na Comutação	Ligar	2916	μJ
	Desligar	3257	μJ

# COOLMOS

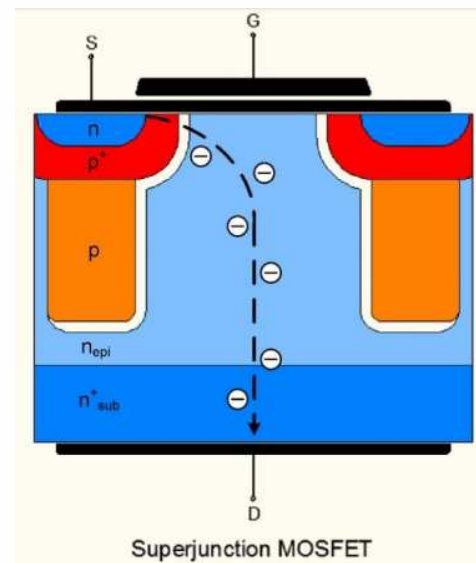
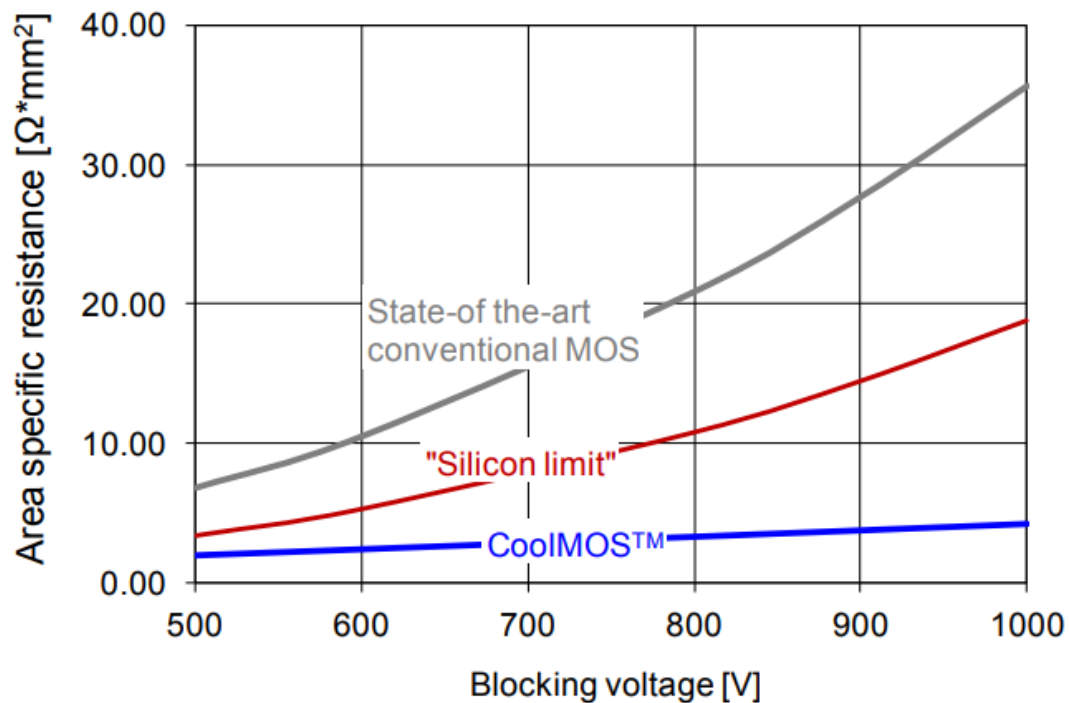
- O COOLMOS, que é uma nova tecnologia para MOSFETs de alta tensão.
- Estrutura de compensação na região vertical de arraste do MOSFET para melhorar a resistência em condução.



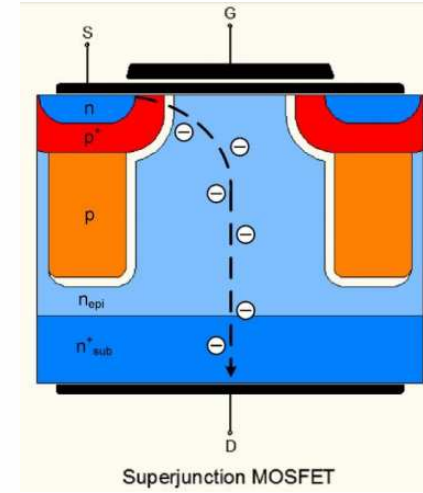
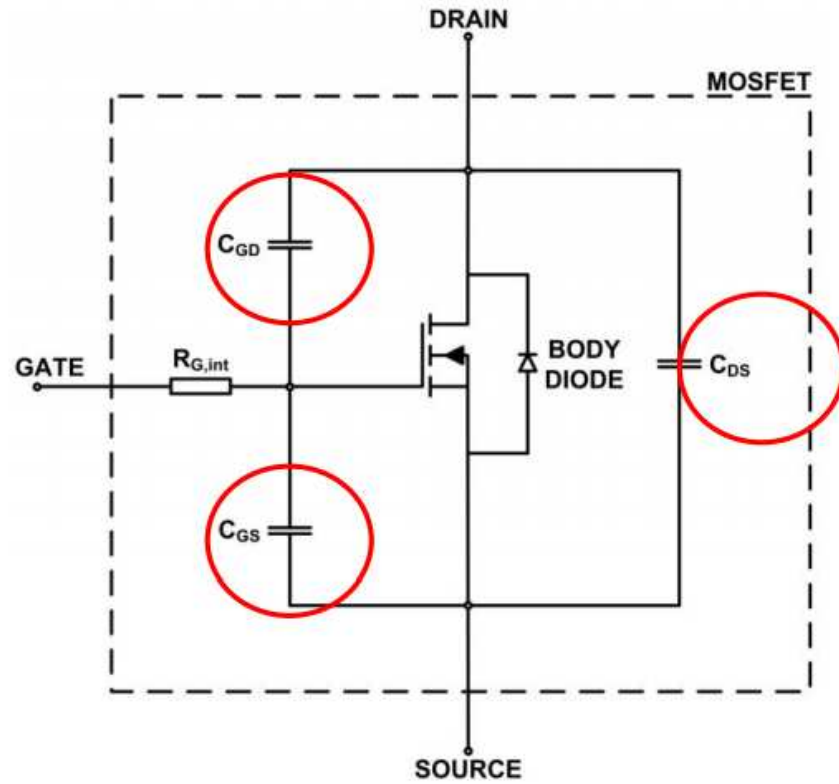
# Comparação MOSFET x COOLMOS



# COOLMOS

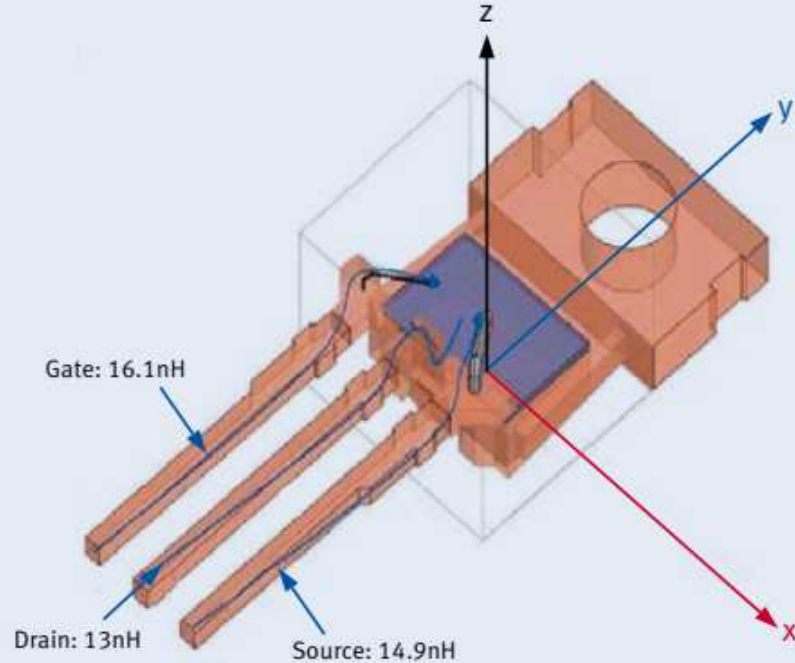


# COOLMOS

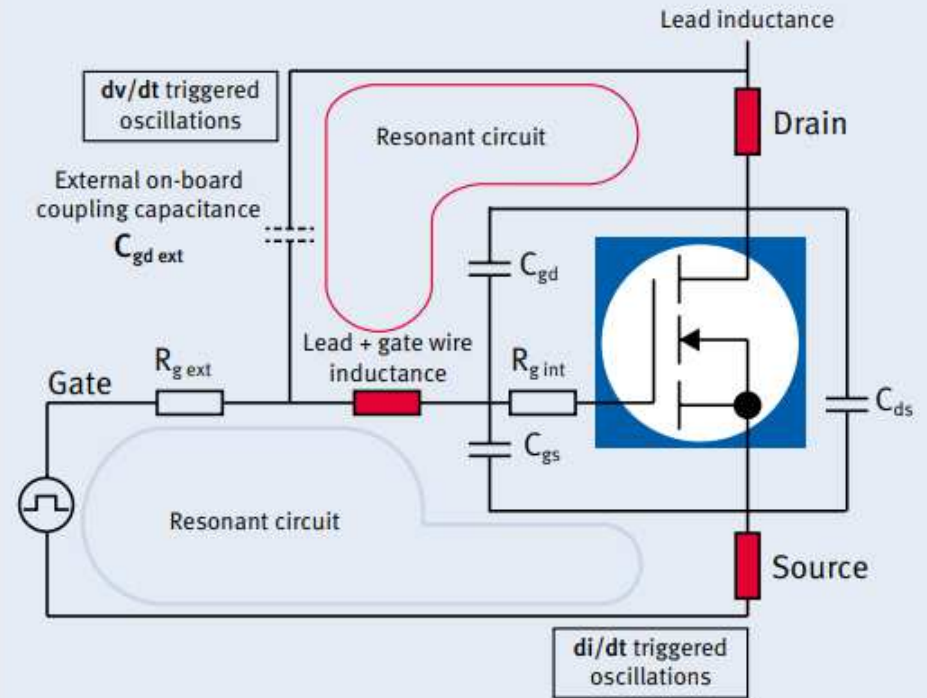


# COOLMOS

Disassembling a MOSFET package parasitics – TO-220

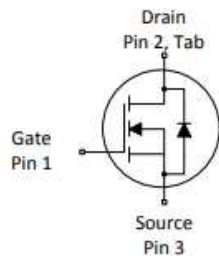
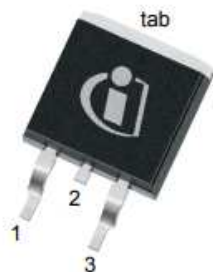


Parasitic LC influence: Damping effect of  $R_{g \text{ int}}$





# COOLMOS



IPB60R040C7

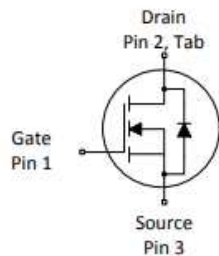
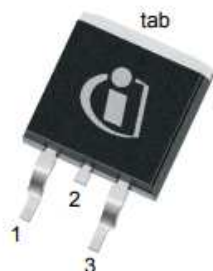


**MOSFET**

600V CoolMOS™ C7 Power Transistor

**Table 1 Key Performance Parameters**

Parameter	Value	Unit
$V_{DS} @ T_{j,max}$	650	V
$R_{DS(on),max}$	40	mΩ
$Q_{g,typ}$	107	nC
$I_{D,pulse}$	211	A
$I_{D,continuous} @ T_j < 150^{\circ}C$	73	A
$E_{oss@400V}$	12.6	μJ
Body diode di/dt	450	A/μs



**IPB60R040C7**



**MOSFET**

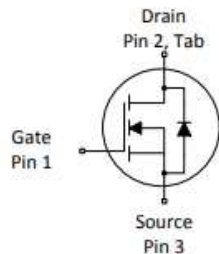
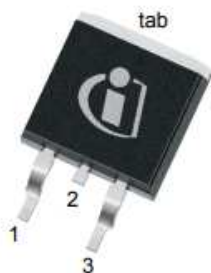
**600V CoolMOS™ C7 Power Transistor**

**Table 4 Static characteristics**

Parameter	Symbol	Values			Unit
		Min.	Typ.	Max.	
Drain-source breakdown voltage	$V_{(BR)DSS}$	600	-	-	V
Gate threshold voltage	$V_{(GS)th}$	3	3.5	4	V
Zero gate voltage drain current	$I_{DSS}$	-	-	1	$\mu$ A
		-	10	-	
Gate-source leakage current	$I_{GSS}$	-	-	100	nA
Drain-source on-state resistance	$R_{DS(on)}$	-	0.034	0.040	$\Omega$
		-	0.077	-	
Gate resistance	$R_G$	-	0.77	-	$\Omega$



# COOLMOS



IPB60R040C7



**MOSFET**

600V CoolMOS™ C7 Power Transistor

**Table 5 Dynamic characteristics**

Parameter	Symbol	Values			Unit
		Min.	Typ.	Max.	
Input capacitance	$C_{iss}$	-	4340	-	pF
Output capacitance	$C_{oss}$	-	85	-	pF
Effective output capacitance, energy related <sup>1)</sup>	$C_{o(er)}$	-	158	-	pF
Effective output capacitance, time related <sup>2)</sup>	$C_{o(tr)}$	-	1640	-	pF



# Abraço!

---

**Heverton Augusto Pereira**

Prof. Departamento de Engenharia Elétrica | UFV

Coordenador da Gerência de Especialistas em Sistemas Elétricos de Potência | Gesep

Membro do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica | PPGEL/CEFET-MG

E-mail: [heverton.pereira@ufv.br](mailto:heverton.pereira@ufv.br)